

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 2354.1 ~ 2354.14—83

PIN、雪崩光电二极管测试方法

1983 - 08 - 15 发布

1984 - 07 - 01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

目 录

SJ 2354.1—83	PIN、雪崩光电二极管光电参数测试方法 总则	(1)
SJ 2354.2—83	PIN、雪崩光电二极管反向击穿电压的测试方法	(3)
SJ 2354.3—83	PIN、雪崩光电二极管暗电流的测试方法	(4)
SJ 2354.4—83	PIN、雪崩光电二极管正向压降的测试方法	(5)
SJ 2354.5—83	PIN、雪崩光电二极管电容的测试方法	(6)
SJ 2354.6—83	PIN、雪崩光电二极管响应度的测试方法	(7)
SJ 2354.7—83	PIN、雪崩光电二极管光谱响应曲线和光谱响应范围的测试方法	(8)
SJ 2354.8—83	PIN、雪崩光电二极管脉冲上升、下降时间的测试方法	(9)
SJ 2354.9—83	PIN、雪崩光电二极管噪声等效功率的测试方法	(10)
SJ 2354.10—83	PIN、雪崩光电二极管列阵串光因子的测试方法	(11)
SJ 2354.11—83	PIN、雪崩光电二极管列阵盲区宽度的测试方法	(13)
SJ 2354.12—83	雪崩光电二极管反向击穿电压温度系数的测试方法	(15)
SJ 2354.13—83	雪崩光电二极管倍增因子的测试方法	(16)
SJ 2354.14—83	雪崩光电二极管过剩噪声指数的测试方法	(17)

PIN、雪崩光电二极管阵列盲区宽度的测试方法

本标准适用于PIN、雪崩光电二极管阵列盲区宽度的测试。

1 测试盲区总的要求应符合SJ 2354.1-83《PIN、雪崩光电二极管光电参数测试方法 总则》。

2 盲区宽度 B_d 的测试

2.1 定义：在规定光波长和反向偏压下，两单元连接处光电流相对于光敏区最大值下降 3 dB 区域的宽度。

2.2 盲区 B_d 大小的测试原理图应符合图 1、图 2。

2.2.1 P型衬底材料所作器件测试原理如图 1。

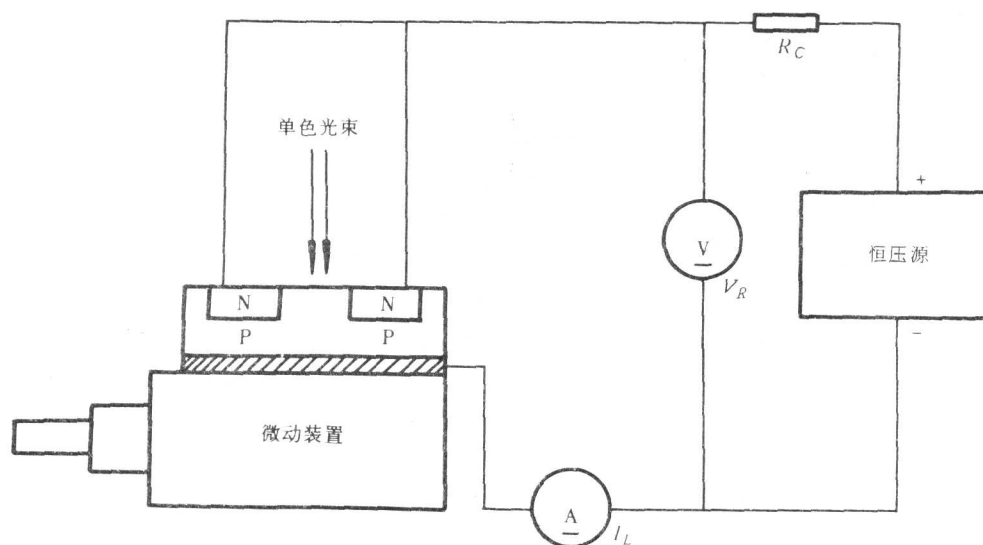


图 1

2.2.2 N型衬底材料所作器件测试原理如图 2。